

# 実用表面分析セミナー2017

共催 (公社)日本表面科学会関西支部、神戸大学研究基盤センター研究支援室機器分析部門

期日 11月30日(木)10:20~18:00

会場 神戸大学 百年記念館六甲ホール (神戸市灘区)

内容 表面分析の実務者やより進んだ表面分析を模索しておられる方を対象。表面分析の解析技術のノウハウやヒント、最新の分析技術の紹介。

参加費 無料 (但し、テキスト代は表面科学基礎講座受講者および表面科学会会員には無料配布、その他一般の方で希望される方は2,000円、学生1,000)

申し込み&ホームページ

[http://www.sssj.org/Kansai/kansai\\_jitsuyou20.html](http://www.sssj.org/Kansai/kansai_jitsuyou20.html)

申込(問い合わせ)先: 日本表面科学会関西支部幹事

田中 肇

日鉄住金テクノロジー株式会社

解析技術部 物理解析室

〒660-0891 兵庫県尼崎市扶桑町1-8

TEL: 06-7670-4168

FAX: 06-6489-5958

E-mail: tanaka-hajime@nsst.jp

## 講演プログラム

10:20	開会挨拶	日本表面科学会関西支部支部長	松本 卓也
一般講演-1 (10:30 - 12:00)			
10:30	(仮)CAMECA 社製3次元アトムプローブの最新技術紹介	アメテック株式会社	石川 真起志
10:45	TEM、SIMS および 3DAP による化合物半導体の高感度・高分解能複合分析	東芝ナノアナリシス株式会社	間山 憲仁
11:00	DF-SIMS および TOF-SIMS を用いた分析事例	株式会社コベルコ科研	黒田 真矢
11:15	Laser-SNMS 分析手法の特徴とその応用	株式会社トヤマ	石川 文晴
11:30	(仮)走査型プローブ顕微鏡(SPM)による最新の表面評価技術	株式会社島津製作所	大田 昌弘
11:45	アサイラム リサーチ AFM による液中観察の最新技術とアプリケーション	オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社	出口 匡
ポスターセッション・展示 & 昼食 (12:00 - 13:15)			
一般講演-2 (13:15 - 14:30)			
13:15	AFM-Raman 装置の実際とその応用 —チップ増強ラマン分光測定技術のご紹介—	株式会社堀場製作所	沼田 朋子
13:30	時間分解分光法によるエレクトロニクスデバイス・材料の評価事例	株式会社住化分析センター	東 遥介
13:45	nanoIR を用いた局所分光・熱分析技術の最新応用事例	株式会社三井化学分析センター	藤村 修平 田中 大策
14:00	新しい XPS の応用例(HAXPES-Lab の紹介)	シエンタ オミクロン株式会社	富塚 仁
14:15	ラボ型硬X線光電子分光分析装置を用いた最新分析事例の紹介	アルバック・ファイ株式会社	井上 りさよ
ポスターセッション・展示 & 休憩 (14:30 - 15:35)			
一般講演-3 (15:35 - 16:20)			
15:35	SEM-AFM 相関解析手法(SAEMic)によるソリューション	株式会社日立ハイテクノロジーズ	野村 貴将
15:50	環境制御型走査電子顕微鏡(ESEM)による表面観察技術の紹介	株式会社カネカテクノリサーチ	藤本 亜由美
16:05	最新の FE-EPMA による微量分析の感度向上	日本電子株式会社	土門 武
交流会 (16:30 - 18:00)			
講演企業と個別に相談したい方に向けた交流会を開催します(軽食を用意しております)			

【ポスター出展企業】上記企業及び (株)リガク、(一財)材料科学技術振興財団、神戸大学研究基盤センター